XRR 解析レポート

プロジェクト

パス: 未保存

DBでの共有レベル: 共有

解析条件

波長(nm): 0.15403 点数: 1451 2θ(°):開始 = 0.200,終了 = 6.000 残差タイプ: |Δ(LogI)|

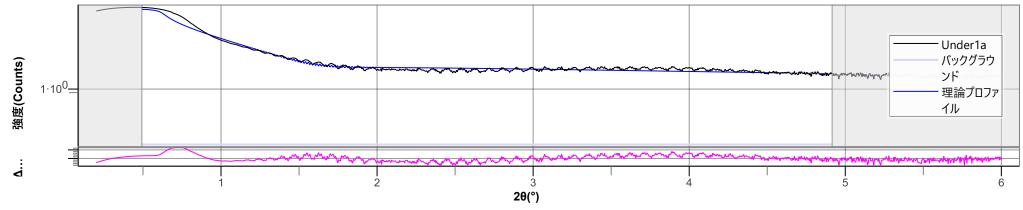
ステップ = 0.004 オフセット=0.000e+000 フィッティング手法: 準ニュートン データ間隔:1点ごとにフィッティング

最大反復数: 500 許容誤差: 1.00e-010

装置関数: 擬Voigt関数 ローレンツ関数の比率: 0.00 ローレンツ幅: 1.00e-002 ガウス幅: 1.00e-002

結果

プロファイルプロット



使用	層番号 ▼	材料	膜厚(nm)		密度(g/cm³) <d></d>		粗さ(nm) <rgh></rgh>	
✓	L4	Fe2O3	378.501	Const	4.95000	Const	2.106	Con
			±5	精密化			±0.03	精密化
<u>~</u>	L3	Fe2O3	63.111	Const	2.47500	Const	83.404	Con
			±0.4	精密化	±0.02 最小←	精密化	±5	精密化
✓	L2	* ° Fe	857.222	Const	7.97400	Const	0.000	Con
			±4E+01	精密化			±0.02最小←	精密化
~	L1	Fe Fe	75.302	Const	4.24015	Const	24.242	Con
			±3	精密化	±0.2 最小←	精密化	±14	精密化
	基板	⊡ Si	∞		2.32924	Const	1.216	Con
							±0.04	精密化